

Nidec

All for dreams

- 特征 -

1. TRL 非接触检测
- TRL Contactless Test
2. 高温检查对应 80 ~ 120°C (可选)
- High temperature inspection
3. 综合定位精度 $\pm 5.0\mu\text{m}$
- Total alignment accuracy
4. 分步 & 重复构造实现高效检测
- Step & Repeat movement

NRFEIS[®] 系列

OPEN/ μ Short/LEAK Test System for Multifaceted FPC
多面FPC用OPEN/ μ Short/LEAK检测装置



NRFEIS-2826
(WS:280×260mm)



NRFEIS-3045
(WS:300×450mm)



自动搬送型

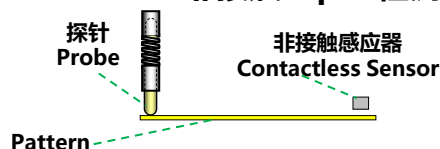


NRFEIS-5060
(WS:510×610mm)

**中型 ~ 大版面Sheet FPC对应、自动化规格、
Role to Role规格、丰富的阵容对应检测
NRFEIS系列-高精度FPC时代的新O/S检测装置。**

TRL 非接触检测
- TRL Contactless Test

Pin to 非接触 Open检测



※TRL 非接触检测为日本电产理德的专利技术。

新Spark检出功能
- NEW Spark Detect Function

1. 高感知度 · 高采样周波数
2. 追加Spark电流检出机能
3. 追加火花波动记忆 · 显示功能。

※新Spark检出功能为日本电产理德的专利技术。

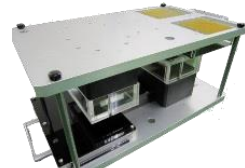
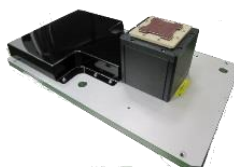
无线扫描
- Cable-less Scanner

通过我司的IC开发技术，将扫描卡小型化。
通过扫描仪到治具夹持部分的无线化，
实现高速度的检测。



简单治具装卸功能
- Easy Fixture Replacement

搭载最新型对位光学模块。
运用智能型对位系统，缩短治具安装时间。



ニデックアドバンステクノロジー株式会社
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION
<https://www.nidec.com/jp/nidec-advancetechnology/>

*Nidec-Read Corporation to be renamed
Nidec Advance Technology Corporation
from April in 2023.

■Headquarters : Nidec PARK Bldg. C, 1-1 Higashinokuchi,
Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0003,
Japan
TEL : 075-315-8558 FAX : 075-315-8011
■Domestic office : Kyoto / Nagoya / Tokyo
■Global office : Taiwan, China / Korea / China / Thai / Canada



More details...

型号	NRFEIS-2826	NRFEIS-3045	NRFEIS-5060
Sheet尺寸	■Sheet尺寸: 100 x 150mm ~ 260(X) x 280mm(Y) ■KOZ : 5mm (4角-□5mm) ■检测范围 : 最大250mm(X) x 270mm (Y) ■检测头部尺寸: 最大250mm(X) x 100mm(Y) ■最小Block尺寸: □50mm	■Sheet尺寸: 70 x 70mm ~ 300(X) x 450mm(Y) ■KOZ : 10mm (4角-□10mm) ■检测范围 : 最大280mm(X) x 430mm (Y) ■检测头部尺寸: 最大250mm(X) x 100mm(Y) ■最小Block尺寸: □30mm	■Sheet尺寸: 100 x 100mm ~ 610(X) x 510mm(Y) ■KOZ : 10mm (4角-□10mm) ■检测范围 : 最大590mm(X) x 490mm (Y) ■检测头部尺寸: 最大250mm(X) x 100mm(Y) ■最小Block尺寸: □30mm
自动对位用相机	上头部: 1相机 下头部: 无相机 下部: 上侧模仿式	上头部: 1相机 下头部: 1相机 在各头部搭载对位相机	上头部: 1相机 下头部: 1相机 在各头部搭载对位相机
治具	READ原创-NRFEIS-FPC治具		
对位精度	重复精度: ±3μm 综合对位精度: ±5μm		
治具头旋转功能	有 (180°旋转)		
NG标记	油墨图章(在治具头处搭载NG标记元件。)		
检测结果数据的读取及保存	■通过READ格式, 可对数据进行读取及保存功能 ■客户所需数据的读取及保存 (可选) ■2D读取功能 (可选)		
HEAD-Press-Force	总计 最大 20kgf		
FPC-夹紧装置	4角 夹紧 & 张力 工作架台、根据工件尺寸调整Manual		
上下料部	对应可能 (规格磋商后进行报价)		

项目	型号名: R-680e/R-6100		
检查Point	Type SD※2	选择Type SD/DD/QD※2	选择Type SD/DD/QD※2
OPEN检测	1Ω ~ 100KΩ / 10V ~ 250V / 0.5mA ~ 20mA 120μs/point (50V / 20mA / 100Ω)		
HP_4端子检测(op)	判定设定电阻范围 : 1mΩ ~ 100Ω_1mΩ:Step (可选: 0.01mΩ ~ 100Ω_0.01mΩ分步) 检测电压 / 电流 : 60V / 20mA 350μsec(Uni. Mode) 680μsec(Bip. Mode) 测定精度 : HP-4W時 ±0.5%±5mΩ ~ ±3%±5mΩ (根据模式选择 & 测定范围变化)		
WR μ-Short检测(op)	1MΩ to 100MΩ / 10V / 1.0mA / 1mΩ ~ < 测定电阻值 150μs / point (1MΩ)		
LEAK检测	10kΩ ~ 1000MΩ (1GΩ) / 10V ~ 250V / 1mA ~ 20mA 150μs/point (250V/20MΩ/20mA/Spark Off)		
HP Spark功能(op)	Spark检出 最短时间 : 0.042μs Spark判定 ΔV (drop voltage)、ΔCurrent 测定电压: 40V to 250V		
TRL非接触检测(op)	检测电压: 50V to 200V TRL单面非接触检测 : 700μs/point		
容量计測 ※1 准备其他系统搭载 lineup机※1:仅R-730搭载 时	容量计測范围: 0.01pF ~ 400pF 最小 析象度: 0.0001pF(0.1fF) 周波数: 10kHz ~ 1MHz (10kHz by step) 外加电压 : 2.0Vrms ~ 6.4Vrms 短路电流:最大 100mA 检测速度: 25ms/16 并列 (Pixel-Cap)		
※2) 检测Point补足	Type SD: 上侧 :1024p 下侧: 1024p 合计最大2048p (SD Block搭载) Type DD: 上侧 :2048p 下侧: 2048p 合计最大4096p (DD Block搭载) Type QD: 上侧 :4096p 下侧: 4096p 合计最大8192p (QD Block搭载) 但是压合能力: max20kg		

